



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100304000B
2011 年 12 月 7 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA(ハイパフォーマンスアナログ) 一部製品 前処理サイト追加のご案内
(認定済 246 製品への追加認定 10 製品の連絡)

(第二版 PCN20100304000A 2010 年 6 月 10 日発行, 初版 PCN20100304000 2010 年 3 月 17 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☒ Process	☒ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	下記変更について認定済246製品への追加認定10製品の連絡になります。 HPA(ハイパフォーマンシアナログ) 一部製品 前処理サイト追加 現行 : DALSA社(カナダ) 変更後: DALSA社(カナダ)、TI-SFAB(Sherman, 米国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	追加認定品は 2012 年 1 月中旬の出荷より予定しています。 認定終了品は 2010 年 7 月中旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	-			

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済246製品への追加認定10製品の連絡になります。弊社 HPA(ハイパフォーマンシアナログ) 一部製品 SiCrプロセス 前処理サイトについて、現行 DALSA社(カナダ)サイトにて製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-SFAB(Sherman, 米国)サイトでの製造を追加し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理サイト	DALSA社(カナダ)/4インチ	DALSA社(カナダ)/4インチ
/ウェーハサイズ		TI-SFAB(Sherman, 米国)/6インチ

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
■: 追加認定品 □: 認定終了品				
ADS574JE	ADS7805U/1KE4	ADS7809UE4	ADS7815U/1KE4	DAC7800KU/1K
ADS574JEG4	ADS7805UB	ADS7809UG4	ADS7815UE4	DAC7800KU/1KG4
ADS574JP	ADS7805UB/1K	ADS7810U	ADS7815UG4	DAC7800KUG4
ADS574JPG4	ADS7805UB/1KE4	ADS7810U/1K	ADS7824P	DAC7800LP
ADS574KE	ADS7805UB-2	ADS7810U/1KE4	ADS7824PB	DAC7800LPG4
ADS574KEG4	ADS7805UB-2E4	ADS7810UB	ADS7824PBG4	DAC7800LU
ADS574KP	ADS7805UBE4	ADS7810UB-1	ADS7824PG4	DAC7800LUG4
ADS574KPG4	ADS7805UBG4	ADS7810UB-1G4	ADS7824U	DAC7801KP
ADS774JE	ADS7805UE4	ADS7810UBE4	ADS7824U/1K	DAC7801KPG4
ADS774JEG4	ADS7805UG4	ADS7810UE4	ADS7824U/1KE4	DAC7801KU
ADS774JP	ADS7806P	ADS7811U	ADS7824UB	DAC7801KU/1K
ADS774JPG4	ADS7806PB	ADS7811U/1K	ADS7824UB/1K	DAC7801KU/1KG4
ADS774JU	ADS7806PBG4	ADS7811U/1KG4	ADS7824UB/1KE4	DAC7801KUG4
ADS774JU/1K	ADS7806PG4	ADS7811U-1	ADS7824UBE4	DAC7801LP
ADS774JU/1KE4	ADS7806U	ADS7811U-1/1K	ADS7824UE4	DAC7801LPG4
ADS774JUE4	ADS7806U/1K	ADS7811U-1/1KG4	ADS7825P	DAC7801LU
ADS774KE	ADS7806U/1KE4	ADS7811U-1G4	ADS7825PB	DAC7801LU/1K
ADS774KEG4	ADS7806U/1KG4	ADS7811UE4	ADS7825PBG4	DAC7801LU/1KG4
ADS774KP	ADS7806UB	ADS7811UG4	ADS7825PG4	DAC7801LUG4
ADS774KPG4	ADS7806UB/1K	ADS7812P	ADS7825U	DAC7802KP
ADS774KU	ADS7806UB/1KE4	ADS7812PB	ADS7825U/1K	DAC7802KU
ADS774KU/1K	ADS7806UBG4	ADS7812PBG4	ADS7825U/1KE4	DAC7802KU/1K
ADS774KU/1KE4	ADS7806UE4	ADS7812PG4	ADS7825UB	DAC7802KU/1KG4
ADS774KUE4	ADS7806UG4	ADS7812U	ADS7825UB/1K	DAC7802KUG4
ADS7800JP	ADS7807P	ADS7812U/1K	ADS7825UB/1KE4	DAC7802LP
ADS7800JPG4	ADS7807PB	ADS7812U/1KE4	ADS7825UBE4	DAC7802LU
ADS7800JU	ADS7807PBG4	ADS7812U/1KG4	ADS7825UBG4	DAC7802LU/1K
ADS7800JU/1K	ADS7807PG4	ADS7812UB	ADS7825UE4	DAC7802LU/1KG4
ADS7800JU/1KE4	ADS7807U	ADS7812UB/1K	ADS7825UG4	DAC7802LUG4
ADS7800JU/1KG4	ADS7807U/1K	ADS7812UB/1KE4	DAC7541AJP	DAC8043U
ADS7800JUE4	ADS7807U/1KE4	ADS7812UB/1KG4	DAC7541AJPG4	DAC8043U/2K5
ADS7800KP	ADS7807U/1KG4	ADS7812UBE4	DAC7541AJU	DAC8043U/2K5G4
ADS7800KPG4	ADS7807UB	ADS7812UBG4	DAC7541AJUG4	DAC8043UC
ADS7800KU	ADS7807UB/1K	ADS7812UE4	DAC7541AKP	DAC8043UC/2K5
ADS7800KUE4	ADS7807UB/1KE4	ADS7812UG4	DAC7541AKPG4	DAC8043UC/2K5G4
ADS7804P	ADS7807UBE4	ADS7813P	DAC7541AKU	DAC8043UCG4
ADS7804PB	ADS7807UBG4	ADS7813PB	DAC7541AKU/1K	DAC8043UG4
ADS7804PBG4	ADS7807UE4	ADS7813PBG4	DAC7541AKU/1KG4	DDC101U
ADS7804PG4	ADS7808U	ADS7813PG4	DAC7541AKUG4	DDC101UG4
ADS7804U	ADS7808U/1K	ADS7813U	DAC7545GLU	MP1ADS7800-W
ADS7804U/1K	ADS7808U/1KE4	ADS7813U/1K	DAC7545GLUG4	MP1ADS7809-W
ADS7804U/1KG4	ADS7808UB	ADS7813U/1KE4	DAC7545GLUR	MP1DAC8043-W
ADS7804UB	ADS7808UBG4	ADS7813U/1KG4	DAC7545GLURG4	PCM1750U
ADS7804UBE4	ADS7808UE4	ADS7813UB	DAC7545JU	PCM1750U/1K
ADS7804UE4	ADS7809U	ADS7813UB/1K	DAC7545JUG4	PCM1750U/1KG4
ADS7804UG4	ADS7809U/1K	ADS7813UB/1KG4	DAC7545KU	PCM1750UG4
ADS7805P	ADS7809U/1KE4	ADS7813UBE4	DAC7545KUG4	VECANA01
ADS7805PB	ADS7809UB	ADS7813UBG4	DAC7545LU	VECANA01G3
ADS7805PBG4	ADS7809UB/1K	ADS7813UE4	DAC7545LUG4	
ADS7805PG4	ADS7809UB/1KE4	ADS7813UG4	DAC7800KP	
ADS7805U	ADS7809UBE4	ADS7815U	DAC7800KPG4	
ADS7805U/1K	ADS7809UBG4	ADS7815U/1K	DAC7800KU	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)及び生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記のようになります。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	DALSA	TI-SFAB
Chip Site Origin (20L): 前処理サイト記号	MTL	SHE
Chip Country Origin (21L): 生産国記号	CAN	USA



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2011 年 11 月 4 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS7809U	Passivation:	7.7kA(SiON)/3.1kA(SiN)	
Wafer Fab Site:	SH-BIP-1	Fab Process:	BB3C93-DLM	
Metallization-1:	8kA AlSi(1%)Cu(.5%)	Metallization-2:	9kA AlCu(.5%)	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size/ Fails
Electrical Char.	Over Temp			Approved
Yield Acceptability	Per Product Eng.			Approved

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年11月30日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS7809UB	Passivation:	7.7kA(SiON)/3.1kA(SiN)	
Wafer Fab Site:	SH-BIP-1	Fab Process:	BB3C93-DLM	
Metallization-1:	8kA AlSi(1%)Cu(.5%)	Metallization-2:	9kA AlCu(.5%)	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test		Condition / Duration		Sample Size/ Fails
Electrical Char.		Over Temp Range		Approved

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 5 月 27 日
信頼性試験 – 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS7805UB	Passivation:	8kA AlSi(1%)Cu(.5%)	
Wafer Fab Site:	SH-BIP-1	Fab Process:	BB3C93-DLM	
Metallization-1:	8kA AlSi(1%)Cu(.5%)	Metallization-2:	9kA AlCu(.5%)	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Steady State Life Test	150C, 168, 300 Hrs		80/0	
**Autoclave	121C, 168 Hrs		85/0	
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles		85/0	
**High Temp Storage Bake	150C, 1000 Hrs		85/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		85/0	
ESD – HBM	500 V		3/0	
ESD – CDM	200, 500 V		3/0	
Latch-up	Per JESD 78 Class II		6/0	
MPY/FTY and Bin Summary	Per specs		Approved	
Electrical Char.	Over Temp		30/0	
Note: ** Preconditioning performed, JEDEC L-3 / 260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 5 月 27 日
信頼性試験 – 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS7807U	Passivation:	(5kA) SiO2/(8kA) SiON	
Wafer Fab Site:	SH-BIP-1	Fab Process:	BB3C93-DLM	
Metallization-1:	AlSi 1.5%	Metallization-2:	AlSi 1%	
信頼性試験結果				
Reliability Test		Condition / Duration		Sample Size/ Fails
**Steady State Life Test		150C, 168, 300 Hrs		80/0
**Autoclave		121C, 168 Hrs		85/0
**Temp Cycle		-65/150C, 1000 cycles		85/0
**High Temp Storage Bake		150C, 1000 Hrs.		85/0
**Biased HAST		130C/85%RH, 96 Hrs		85/0
ESD – HBM		500, 1000, 1500, 2000 V		3/0
ESD – CDM		200, 500 V		3/0
Latch-up		Per JESD 78 Class II		6/0
MPY/FTY and Bin Summary		Per specs		Approved
Electrical Char.		Over Temp		30/0
Note: ** Preconditioning performed, JEDEC L-3 / 260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 5 月 27 日
信頼性試験 – 試料構成詳細				
Qual Device:	DAC7800LU	Passivation:	7.7kA(SiON)/3.1kA(SiN)	
Wafer Fab Site:	SH-BIP-1	Fab Process:	BB3C93-DLM	
Metallization-1:	8kA AlSi(1%)Cu(.5%)	Metallization-2:	9kA AlCu(.5%)	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Steady State Life Test	150C, 168, 300 Hrs		80/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		85/0	
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles		79/0	
**High Temp Storage Bake	150C, 1000 Hrs.		85/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		85/0	
ESD – HBM	500, 1000, 1500, 2000 V		3/0	
ESD – CDM	200, 500 V		3/0	
Latch-up	Per JESD 78 Class II		6/0	
MPY/FTY and Bin Summary	Per specs		Approved	
Electrical Char.	Over Temp		30/0	
Note: ** Preconditioning performed, JEDEC L-3 / 260C				